

●SOT-89 パッケージ許容損失

SOT-89 パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1. 測定条件(参考データ)

測定条件：基板実装状態

雰囲気：自然対流

実装：Pb フリーはんだ

実装基板：基板 40mm×40mm (片面 1600mm²) に対して

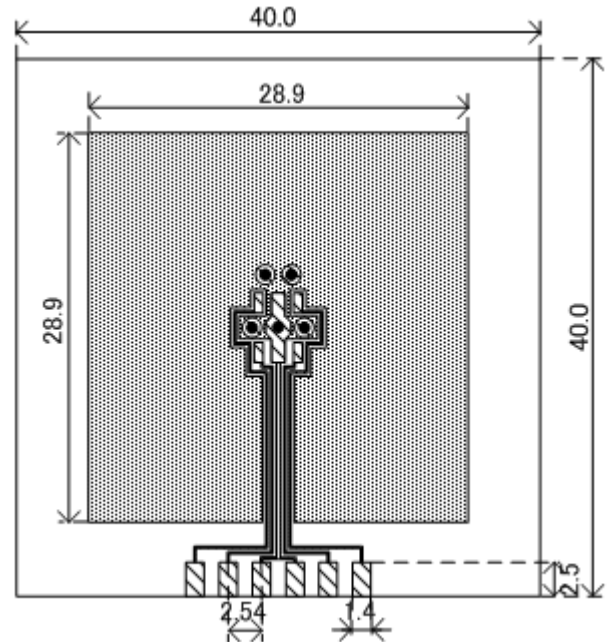
銅箔面積 表面 約 50%—裏面 約 50%

放熱板と周りの銅箔接続

基板材質：ガラスエポキシ (FR-4)

板厚：1.6mm

スルーホール：ホール径 0.8mm 5 個

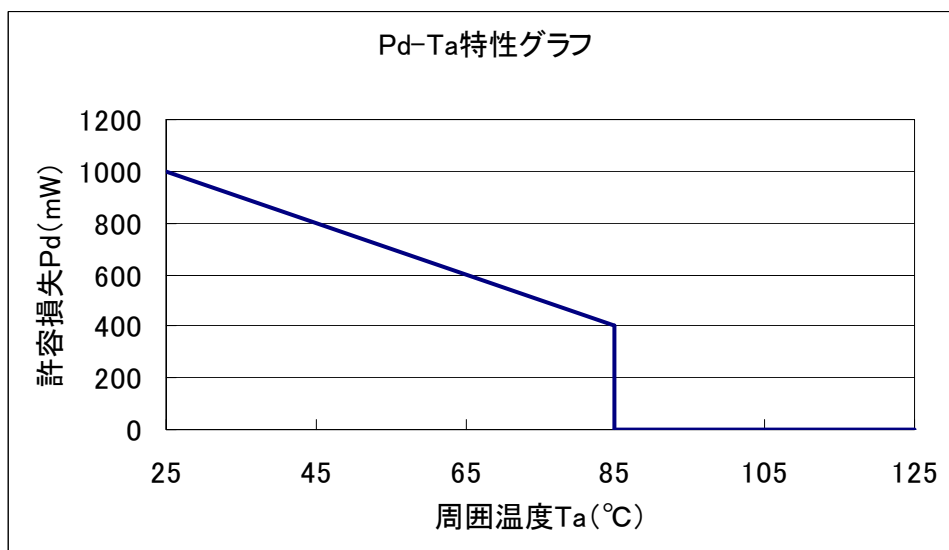


評価基板レイアウト(単位:mm)

2. 許容損失-周囲温度特性

基板実装($T_{jmax}=125^{\circ}\text{C}$)

周囲温度(°C)	許容損失 Pd (mW)	熱抵抗(°C/W)
25	1000	100.00
85	400	



●SOT-89 パッケージ許容損失($T_j=150^{\circ}\text{C}$)

MOSFET 専用データ

SOT-89 パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1. 測定条件(参考データ)

測定条件：基板実装状態

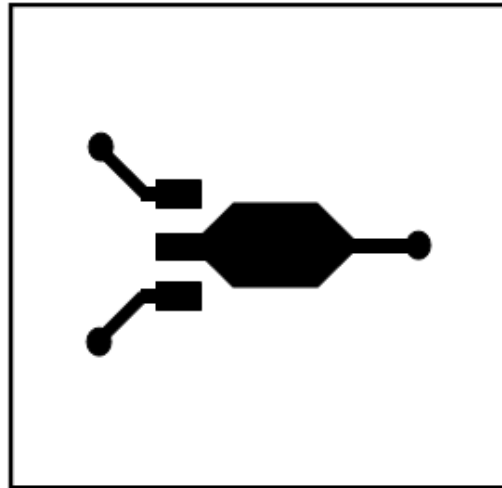
雰囲気：自然対流

実装：Pb フリーはんだ

実装基盤：基板 250mm^2

基板材質：セラミック

板厚：0.8mm



評価基板レイアウト(単位：mm)

2. 許容損失-周囲温度特性

基板実装($T_{j\max}=150^{\circ}\text{C}$)

周囲温度($^{\circ}\text{C}$)	許容損失 P_d (mW)	熱抵抗($^{\circ}\text{C}/\text{W}$)
25	1000	83.33
105	540	

